

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△						△					
△						△					
適用規格											
定 格	使用温度範囲		-55℃～85℃(注1)			保存温度範囲		-10℃～60℃(注2)			
	電 圧		AC 125 V			使用湿度範囲		40%～80%			
	電 流		0.5 A			保存湿度範囲		40%～70%(注2)			
性 能											
	項 目	試 験 方 法				規 格		QT	AT		
構 造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。		○	○		
	表示	目視にて確認する。						○	○		
電 氣 的 性 能	接触抵抗	100 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。				45 mΩ以下		○	—		
	低電圧、低電流下の接触抵抗	20 mV 以下、1 mA (DC または 1000 Hz) で測定する。				55 mΩ以下		○	—		
	絶縁抵抗	DC 250 Vで測定する。				100 MΩ以上		○	—		
	耐電圧	AC 300 Vの電圧を1分間印加する。				せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	—		
	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。				差込力 (0.882 × **) N 以下 引抜力 (0.098 × **) N 以上		○	—		
機 械 的 性 能	繰り返し動作	500 回の抜き差しを行う。				① 接触抵抗: 55 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—		
	耐振性	周波数 10～55 Hz, 全振幅 1.52 mm, 3 方向各 2 時間試験する。				① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—		
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3方向各 3 回試験する。						○	—		
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96 時間放置する。				① 接触抵抗: 55 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上		○	—		
	温度サイクル	温度 -55→+15→+35→+85→+15→+35℃ 時間 30→10→15→30→10→15 分 を 5 サイクル試験する。				③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—		
	塩水噴霧	濃度 5% の塩水、48 時間放置する。				① 接触抵抗: 55 mΩ以下		○	—		
	硫化水素	濃度 3 ppm、96 時間放置する。 (試験規格: JEIDA 38)				② はなはだしい腐食がないこと。		○	—		
	はんだ耐熱性	はんだ槽の場合: はんだ温度 260±5℃ 浸せき時間 10±1秒間				外観の変形及び端子などに著しい ガタのないこと。		○	—		
		はんだごての場合: こて温度 360℃ はんだ付け時間 5 秒以内						○	—		
	はんだ付け性	はんだ温度 240±3℃, 浸せき時間 2 秒間のはんだ付けを行う。				はんだ浸せき面の 95%以上が 新しいはんだでぬれていること。		○	—		
備考						製 図	担 当	検 図	承 認	出 図	
注1. 通電時の温度上昇を含みます。 注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。 注3. **は極数を示します。											
試験規格の記載のない試験方法はMIL-STD-1344を適用している。											
注 QT:確認試験 AT:製品検査 O:適用項目											
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.						製品規格表			製品名 FX2-**S-1.27DSL(71)		
IBCL CL			図番 SLC4-083296-21			製品コード CL572			1 1		